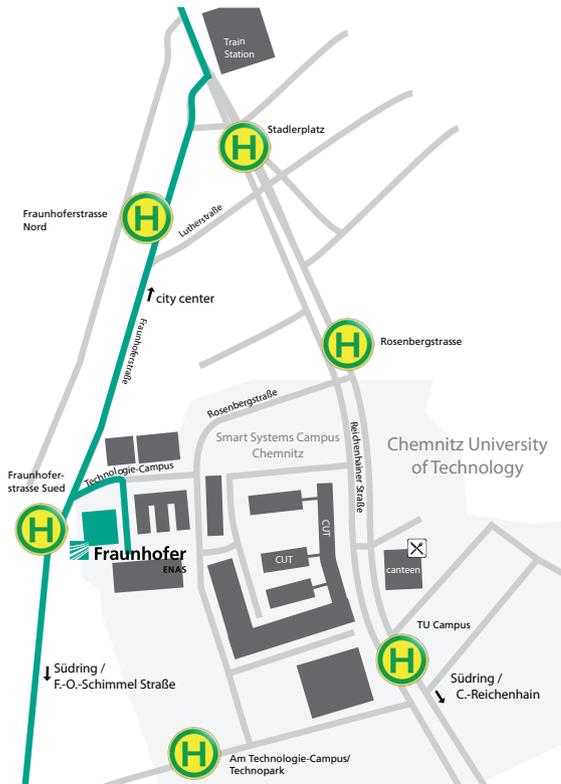


ANFAHRT

FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR
ELEKTRONISCHE NANOSYSTEME ENAS



Fraunhofer-Institut für Elektronische Nanosysteme ENAS
Technologie-Campus 3 | 09126 Chemnitz

Seminarleiter

Prof. Dr. Sven Rzepka

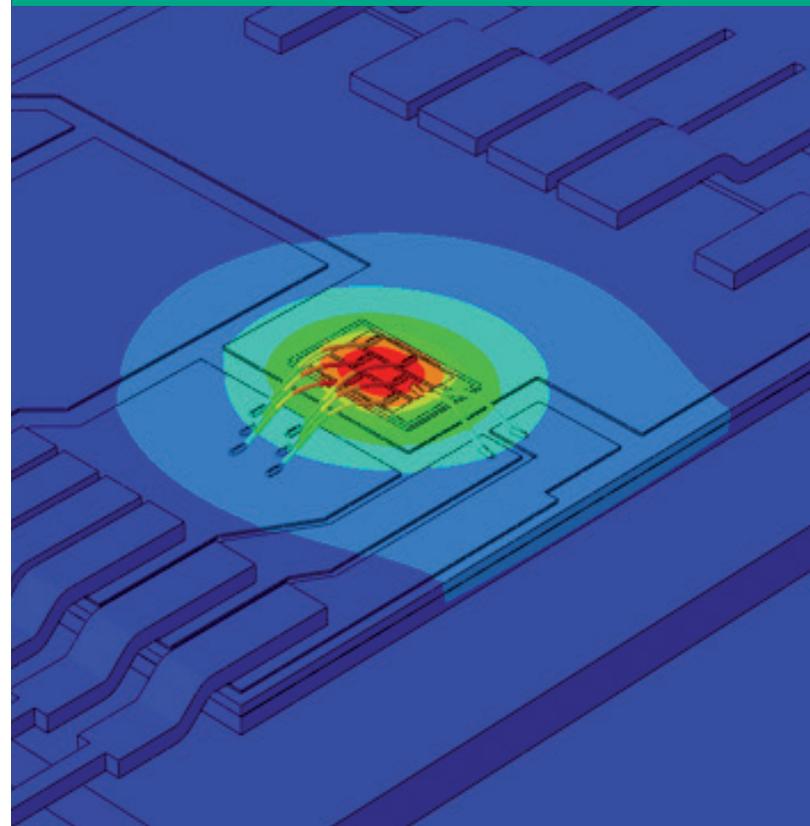
Tel.: +49 371 45001-421

sven.rzepka@enas.fraunhofer.de

www.enas.fraunhofer.de

CHEMNITZER SEMINAR

»ZUVERLÄSSIGKEIT UND FUNKTIONALE SICHERHEIT ELEKTRONISCHER KOMPONENTEN UND SYSTEME«



PROGRAMM

CHEMNITZER SEMINAR
NANOTECHNOLOGY | NANOMATERIALS |
NANORELIABILITY

»ZUVERLÄSSIGKEIT UND FUNKTIONALE SICHERHEIT ELEKTRONISCHER KOMPONENTEN UND SYSTEME«

Wir laden Sie recht herzlich zu unserem Chemnitzer Seminar zum Thema »Zuverlässigkeit und funktionale Sicherheit elektronischer Komponenten und Systeme«

am Mittwoch, dem 14. November 2018
von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr
am Fraunhofer-Institut für Elektronische Nanosysteme ENAS

ein. Die Veranstaltung ist kostenfrei.
Bitte senden Sie bis zum 30.10.2018
ein E-Mail mit Ihrer Anmeldung an events@enas.fraunhofer.de.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an den Seminarleiter
oder gern auch an
Ilona Soremski
Tel: +49 371 45001-220
ilona.soremski@enas.fraunhofer.de

13:00 Uhr	Begrüßung Prof. Dr. Sven Rzepka , Fraunhofer ENAS
13:10 Uhr	Keynote: Funktionale Sicherheit in automotiven Anwendungen Filippo Vitiello, Conti Temic microelectronic GmbH
14:00 Uhr	Concept of future, safety-related smart system with self-testing capabilities Dr. Przemyslaw Gromala, Robert Bosch GmbH
14:30 Uhr	Entwicklungstrends in der Verbindungs- technik und Herausforderungen an die Zuverlässigkeit Jörg Trodler, Heraeus Materials Technology GmbH & Co KG
15:00 Uhr	Pause
15:30 Uhr	AVT-bezogene Prognose der Genauigkeit und Zuverlässigkeit von Sensoren und MEMS in rauer Umgebung Prof. Dr. Jürgen Wilde, Albert-Ludwigs- Universität Freiburg
16:00 Uhr	Kombinierte experimentelle und simulative Untersuchungen zu Beanspruchungseffekten durch Baugruppenmontage Dr. Rainer Dudek, Fraunhofer ENAS
16:20 Uhr	Computational methodologies for integrity assessment of composite structures with embedded sensors Dr. Damaso de Bono, TWI Manchester
16:40 Uhr	New measurement and characterization equipment for thermal and thermo- mechanical effects Mohamad Abo Ras, Berliner Nanotest und Design GmbH
17:00 Uhr	Abschluss